



Федеральное государственное бюджетное учреждение науки
Институт автоматки и электрометрии
Сибирского отделения Российской академии наук
(ИАиЭ СО РАН)

06 ноября 2018 г.

Пресс-релиз

Делегация Исследовательского центра Самсунг ознакомилась с разработками Института автоматки и электрометрии СО РАН

30 октября состоялся визит делегации Исследовательского центра Самсунг в Институт автоматки и электрометрии СО РАН.

Делегацию возглавил вице-президент компании Samsung Electronics, директор Исследовательского центра Самсунг Jin Wook Lee.

Заместитель директора по научной работе д.т.н. В.П. Корольков представил информацию об Институте, а затем провёл экскурсию по нескольким лабораториям.

Члены делегации ознакомились с деятельностью ИАиЭ СО РАН в области компьютерной графики и дополненной реальности, проблем создания высокочувствительных скоростных газовых сенсоров, электретных MEMS-генераторов.



Фотографии: А.Т. Когабаева

Пресс-релиз на сайте ИАиЭ СО РАН:

https://www.iae.nsk.su/images/stories/0_News/2018/181106-Samsung.pdf